MicroPoise® MEASUREMENT SYSTEMS / AMETEK®

TGIS SL®

TGIS SL® 轮胎几何外观检测系统

Micro-Poise® 产品为您带来先进技术，支持您最关键的技术规范。TGIS SL®轮胎几何外观检测系统采用AkroSCAN™线激光传感器。我们独一无二的TGIS软件与Micro-Poise®几何外观检测系统的传感器运动机构配合使用，读取测试配方，准确收集和处理数据，以控制其运动。TGIS服务器可以与各种主机应用程序通信，以确保满足您的所有测试需求。

功能:

- 检测扫描范围大，可进行完整的轮胎测量
- 用户友好型RadViewer软件
- 可自定义数据采集位置
- 便于观察和设置检测工艺及配方
- 软硬件均置于一个单独可移动的电柜中
- X-轴方向滑动用于径向轴自动定位
- 可提供镜头遮护器
- 以太网通信

优点:

- 有助于改善胎侧外观质量
- 滤波程序以消除不相关的信息
- 使用排除区域技术检测胎侧文字和装饰区域
- 数据与各个轮胎的ID关联

MicroPoise® MEASUREMENT SYSTEMS / AMETEK®

TGIS SL® 技术指标

与之集成的机器:	带穿梭润滑处理装置的 AkroDYNE®
操作软件:	RadViewer 检测软件 AkroDYNE®/判级–打标–分级 配方检测软件
LRO & RRO 谐波**:**	可选择多达 50 次谐波，用于即时可视化及分析

性能: 精度

鼓包、凹陷、峰–峰值	+/- 0.05 mm
*侧向、径向不圆度、摆动**	+/- 0.05 mm

**使用 TGIS 校验装置*

Micro-Tech™ TrueView™ 传感器技术指标
数据点采集:

扫描速度@128 行	每秒4000 轮廓线
每转轮廓线	4000
每个轮廓线点数	1536
每一扫描点数	3 百万至 6 百万个
传感器扫描宽度 – 径向和侧向	50-150 mm
传感器 临界工作距离 – 径向和侧向	190-310 mm
传感器等级	IIA (USA) / IIIR (Europe)
编码器接口	与传感器直连

凭借105多年的创新经验，我们始终引领轮胎测量系统向前发展。
Micro-Poise® 精益求精，用心测量

TGIS SL : 12/2023

MP USA
Tel: +1-330-541-9100
Fax: +1-330-541-9111

MP Europe
Tel: +49-451-89096-0
Fax: +49-451-89096-24

MP Korea
Tel: +82-31-888-5259
Fax: +82-31-888-5228

MP China
Tel: +86-20-8363-4768 Ext 108
Fax: +86-20-8363-3701

MP India
Tel: +91-44-6699-5700
Fax: +91-44-6699-5721

Akron Standard®, Micro-Poise®, TGIS FS, and Coll-Tech. ©2023 by AMETEK®, Inc. All rights reserved.